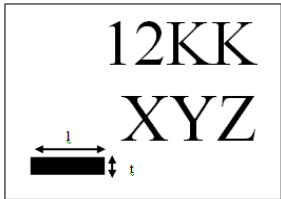
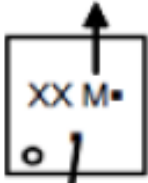




Title of Change:	Adding assembly and final test location for 10 lead and 12 lead UQFN packages.	
Proposed first ship date:	7 March 2019 or earlier after customer approval.	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Jeremy.Ferris@onsemi.com>	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Rob.Travis@onsemi.com>	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	Change will be identifiable by the new top mark scheme as described below.	
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☒ Assembly Change ☒ Test Change ☐ Other _____	
Change Sub-Category(s):	☒ Manufacturing Site Addition ☐ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☒ Shipping/Packaging/Marking ☐ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Tarlac City, Philippines	External Foundry/Subcon Sites: Utac Hana
Description and Purpose:		
Assembly and Final Test Location Change:		
	Before Change Description	After Change Description
Assembly & Final Test	Sub-contractor, Bangkok, Thailand	ON Semiconductor Tarlac, Philippines Sub-contractor, Bangkok, Thailand
Shipping Quantity Change:		
	Before Change Description	After Change Description
Quantity per reel	5k (No Change)	
Quantity boxes in intermediate box	3 reels/box	5 reels/box



Top Mark Layout Change:

	Before Change Description	After Change Description
Top Mark Layout	 Pin #1 identifier l = 0.4 mm (Min) t = 0.08 mm (Min) 1ST LINE MARKING: 12 : Device Code KK : Lot Trace Code (&K) 2ND LINE MARKING: XY : Two Digit Date Code (&2) Z : Assembly Plant Code (&Z), (Appendix A)	Style 1 One digit date  Option 1 Option 2 Micro dot Pb free
2 Digit Device Code	No Change	
Lot Trace Code	Line 1: KK	N/A
Date Code	Line 2: XY	Line 1: M
Plant Code	Line 2: Z	Line 1: M orientation
Pb free mark	N/A	Micro dot

Reason for Change: Improved supply chain flexibility

There are no product material changes as a result of this change.

Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: FSUSB42UMX

RMS: W48527/ O48573

PACKAGE uQFN10

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/160
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/160
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/160
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH, 18.8psig, bias	264 hrs	0/160
uHAST	JESD22-A118	110°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	264 hrs	0/160
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/480
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/20
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/30
PD	JESD22-B100	N/A		0/20



QV DEVICE NAME: FSA2275UMX

RMS: W48564/O48603

PACKAGE uQFN12

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/160
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/160
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/160
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH, 18.8psig, bias	264 hrs	0/160
uHAST	JESD22-A118	110°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	264 hrs	0/160
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/480
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/20
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/30
PD	JESD22-B100	N/A		0/20

Electrical Characteristic Summary: Electrical characteristics are not impacted**List of Affected Parts:**

Part Number	Qualification Vehicle
FSA2275AUMX	FSA2275UMX
FSA805UMX	FSA2275UMX
FSA806UMX	FSA2275UMX
FSA2275UMX	FSA2275UMX
FSA2276UMX	FSA2275UMX
FSA3030UMX	FSA2275UMX
FSUSB63UMX	FSA2275UMX
FXLA104UM12X	FSA2275UMX
FXMAR2104UMX	FSA2275UMX
FSUSB42UMX	FSUSB42UMX
FSA223UMX	FSUSB42UMX
FSA321UMX	FSUSB42UMX
FSA2259UMX	FSUSB42UMX
FSA2268UMX	FSUSB42UMX
FSA2269TUMX	FSUSB42UMX
FSA2269UMX	FSUSB42UMX
FSUSB104UMX	FSUSB42UMX
FSUSB30UMX	FSUSB42UMX
FSUSB45UMX	FSUSB42UMX
FT8010UMX	FSUSB42UMX
FSUSB42UMX-SN00404	FSUSB42UMX

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

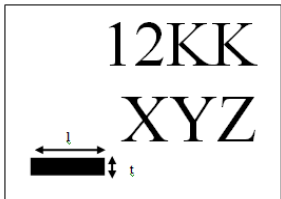
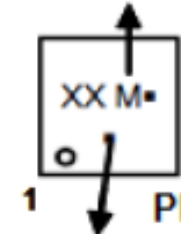
文書番号: FPCN22032X

発行日: 28 November 2018

変更件名:	10 リードおよび 12 リード UQFN パッケージの組立て・テスト拠点追加	
初回出荷予定日:	7 March 2019 (またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前)	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Jeremy.Ferris@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN、または最終 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
その他の信頼性データ:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Rob.Travis@onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> をお願いします。	
変更部品の識別:	変更は以下の記載のとおり新しい捺印様式により識別できます。	
変更カテゴリ:	☐ ウェハファブの変更 ☒ アセンブリの変更 ☒ 試験の変更 ☐ その他 _____	
変更サブカテゴリ:	☒ 製造拠点の追加 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製造プロセスの変更 ☐ 材料の変更 ☐ 製品仕様の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☒ 出荷/パッケージング/表記 ☐ その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: タルラック市 (フィリピン)	外部製造工場または下請業者拠点: UTAC HANA
説明および目的:		
組み立ておよび最終試験場所の変更:		
	変更前の表記	変更後の表記
組立ておよび最終テスト	下請業者、バンコク市 (タイ)	オン・セミコンダクター、タルラック市 (フィリピン) 下請業者、バンコク市 (タイ)
出荷数量の変更:		
	変更前の表記	変更後の表記
リールあたりの数量	5k (変更なし)	
中箱内のボックス数	3 リール/ボックス	5 リール/ボックス



トップマーキング様式変更:

	変更前の表記	変更後の表記
トップマーキング様式	 Pin #1 identifier l = 0.4 mm (Min) t = 0.08 mm (Min) 1ST LINE MARKING: 12 : Device Code KK : Lot Trace Code (&K) 2ND LINE MARKING: XY : Two Digit Date Code (&2) Z : Assembly Plant Code (&Z), (Appendix A)	Style 1 One digit date  Option 1 Option 2 Micro dot Pb free
2桁のデバイスコード	変更なし	
ロットトレースコード	ライン 1: KK	該当なし
日付コード	ライン 2: XY	ライン 1: M
工場コード	ライン 2: Z	ライン 1: M 方向
鉛フリーマーク	該当なし	マイクロドット

変更の理由: サプライチェーンの柔軟性の向上

今回の変更に伴う製品材料の変更はありません。

信頼性データの要約:

QV 素子名: FSUSB42UMX

RMS: W48527/O48573

パッケージ uQFN10

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta = 125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/160
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150°C	1008 hrs	0/160
TC	JESD22-A104	Ta = -65°C to +150°C	1000 cyc	0/160
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH, 18.8psig, bias	264 hrs	0/160
uHAST	JESD22-A118	110°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	264 hrs	0/160
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/480
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/20
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/30
PD	JESD22-B100	N/A		0/20



QV 素子名: FSA2275UMX

RMS: W48564/O48603

パッケージ uQFN12

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/160
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/160
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/160
HAST	JESD22-A110	110°C, 85% RH, 18.8psig, bias	264 hrs	0/160
uHAST	JESD22-A118	110°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	264 hrs	0/160
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/480
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/20
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/30
PD	JESD22-B100	N/A		0/20

電氣的特性の要約: 電氣的特性への影響はありません

影響を受ける部品の一覧:

部品番号	品質試験用ピークル
FSA2275AUMX	FSA2275UMX
FSA805UMX	FSA2275UMX
FSA806UMX	FSA2275UMX
FSA2275UMX	FSA2275UMX
FSA2276UMX	FSA2275UMX
FSA3030UMX	FSA2275UMX
FSUSB63UMX	FSA2275UMX
FXLA104UM12X	FSA2275UMX
FXMAR2104UMX	FSA2275UMX
FSUSB42UMX	FSUSB42UMX
FSA223UMX	FSUSB42UMX
FSA321UMX	FSUSB42UMX
FSA2259UMX	FSUSB42UMX
FSA2268UMX	FSUSB42UMX
FSA2269TUMX	FSUSB42UMX
FSA2269UMX	FSUSB42UMX
FSUSB104UMX	FSUSB42UMX
FSUSB30UMX	FSUSB42UMX
FSUSB45UMX	FSUSB42UMX
FT8010UMX	FSUSB42UMX
FSUSB42UMX-SN00404	FSUSB42UMX